

不具合発生的重要なお知らせ

2010年2月1日



JFE アレック 株式会社

神戸市西区井吹台東町7丁目2番-3

このたび、弊社製品 Compact シリーズに不具合が発生致しました。対象機種を御使用の御客様に大変ご迷惑をお掛けしました事、心よりお詫び申し上げます。既に、ダイレクトメール・電話連絡等で御案内させて頂いておりますが、万一連絡未着の御客様がありましたら、下記連絡先まで御問合せくださいますよう、お願い申し上げます。

1. 不具合の状況

2009年より2010年にかけて、年を跨いで観測中の対象機器について、2010年1月1日0時0分から観測を停止します。原因は、機器内部のCPUに書き込まれたカレンダー機能のソフト中のバグに因るもので、10年毎に観測を停止する不具合であることが判明致しました。(次回は2020年1月1日が該当します)

2. 現状の緊急対応

対象機器を年をまたいで御使用中の御客様には、下記の対応をお願い致します。

- 1) 対象機器の回収を行って頂き、データ収録を実施します。(2009年12月31日までのデータは機器内部メモリーに保存されています)
- 2) 新たに観測設定を行う事で、観測を再開することができます。

3. 是正の内容

測器内部のCPU電子基板上のプログラムIC(PIC)を交換致します。

実施時期については現在検討を進めていますが、対象機器が3500台あり是正には数年を要しますので、随時御客様へ連絡をさせて頂きます。なお、対象機器につきまして、2019年末まで確実に動作することを確認していますので、是正を実施するまでの期間の御使用については全く問題がありません。

4. お問い合わせ先

本社営業部 tel 078-997-8686

東京営業所 tel 03-5821-6038

Mail : info@jfe-alec.co.jp

5. 対象機種は次ページをご参照願います。

コンパクト2010年問題 不具合該当機種

Firmware	機種名	メーカーコード	
		メモリ式	有線式
5TD	水温深度計 Compact-TD (HG型)	ATD-HG	
	水温塩分計 Compact-CT (HG型)	ACT-HG	
CEM	電磁流速計 Compact-EM	AEM-HR	
	溶存酸素計 Compact-DO	ADO-CMP	
	水温塩分深度計 Compact-CTD Lite	ACTD-CMP	
	水温塩分深度計 Compact-CTD Lite (HG型)	ACTD-CMP HG	
CKU	クロロフィル濁度計 Compact-CL	ACL-CMP	ACL-RS
	クロロフィル濁度計 Compact-CLW	ACLW-CMP	ACLW-RS
	溶存酸素計 Compact-DOW	ADOW-CMP	ADOW-RS
	光量子計 Compact-LW	ALW-CMP	ALW-RS
	光量子計 Compact-LTD	AL30-CMP	AL30-RS
	超高濃度濁度計 Compact-HTW	ATU3W-CMP	ATU3W-RS
	超低濃度濁度計 Compact-LT	ATU6-CMP	ATU6-RS
	超低濃度濁度計 Compact-LTW	ATU6W-CMP	ATU6W-RS
	水温塩分計 Compact-CT		ACT-RS
	水温深度計 Compact-TD		ATD-RS
	電磁流速計 Compact-EM		AEM-RS
	溶存酸素計 Compact-DO		ADO-RS
	水温塩分深度計 Compact-CTD Lite		ACTD-RS
	水温塩分深度計 Compact-CTD Lite (HG型)		ACTD-RS HG
	電磁流向流速計 AEM213		AEM213-RS
CWH	波高計 Compact-WH	AWH-CMP	AWH-RS
C8L	分光光量子計 Compact-8LW	AL8W-CMP	AL8W-RS
	多波長励起蛍光光度計 Compact-MFLUW	AMFLUW-CMP	AMFLUW-RS

* 上記機種以外は不具合を起こさないことを確認致しております。